

فصلنامه علمى پژوهشى



مهندسی مکانیک جامدات

http://jsme.iaukhsh.ac.ir



مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی ارتعاشات غیرخطی تیر میکرونی پیزوالکتریک در حالت خود انداز گیر میکروسکوپ نیروی اتمی

رضا قادری'، احمد حقانی'**

* نویسنده مسئول: a.haghani@iaushk.ac.ir

چکیدہ	واژههای کلیدی	
امروزه میکروسکوپ نیروی اتمی به عنوان ابزاری کار آمد در تعیین نیروهای بین مولکولی و توپو گرافی	ارتعاش غیرخطی، میکرو	و تيـر پيزوالکتريـک.
سطح با دقت نانومتری شناخته میشود. در این نوع میکروسکوپها، میکرو تیر به عنوان قلب	خود اندازه گیر، شارژ	
میکروسکوپ شناخته میشود و به عنوان وسیله اندازه گیری بکار گرفته میشود. در بین میکرو تیرهای		
رایج در میکروسکوپ نیروی اتمی، میکرو تیرهای پیزوالکتریک نسل جدیدی از تیرها می،باشند که با	تاريخ ارسال:	90/01/14
ت قابلیت خود محرک و خود اندازه گیر از محبوبیت بالایی در بین سایر تیرها برخوردار می باشند.	تاريخ بازنگري:	90/08/7
هدف این مقاله بررسی رفتار میکرو تیر پیزوالکتریک با سر مثلثی در حالت خود اندازه گیر و در نزدیکی	تاريخ پذيرش:	90/00/14
سطح نمونه میباشد. در این حالت شارژ خروجی از لایه پیزوالکتریک و همچنین جریان خروجی از آن		
به عنوان عاملی موثر در اندازه گیری خمش محسوب میشوند. با نزدیک شدن میکرو تیر به سطح نمونه		
رفتار ارتعاشی آن غیرخطی میشود. مسلماً لایه پیزوالکتریک در حالت خود اندازه گیر زمانی میتواند به		
عنوان اندازه گیر مناسب تلقی شود که بتواند تاثیر نیروی غیرخطی برهم کنش بین نو ک پراب و سطح نمونه		
را اندازه گیریهای خود نمایان کنند. به منظور بررسی این موضوع در ابتدا با استفاده از روش تقریبی		
گلرکین معادله دیفرانسیل حاکم بر حرکت ارتعاشی میکرو تیر پیزوالکتریک با سر مثلثی به معادله		
ديفرانسيل معمولي غيرخطي تبديل ميشود. سپس به كمك روش چند مقياسي معادله ديفرانسيل غيرخطي		
به دست آمده حل میشود. پس از حل معادله دیفرانسیل حاکم بر مساله به شبیهسازی چگونگی رفتار		
میکرو تیر در حالت خود اندازه گیر در نزدیکی سطح نمونه پرداخته میشود و تاثیر عواملی چون فاصله		
تعادلی، مدهای نوسانی و جنس لایه پیزوالکتریک مورد بررسی قرار می گیرد.		

۲- دانشجوی دکترا، دانشکده مکانیک، گروه مهندسی، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد، ایران.

۱- استادیار، دانشکده مکانیک، گروه مهندسی، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد، ایران.



Dynamic modeling and nonlinear vibration analysis of piezoelectric microbeam in self sensing mode of an atomic force microscope

Reza Ghaderi¹, Ahmad Haghani^{2,*}

* Corresponding Author: a.haghani@iaushk.ac.ir

Abstract:	Key words:
Nowadays, atomic force microscopes are considered as useful	Nonlinear vibrations,
tools in the determination of intermolecular forces and surface	piezoelectric micro-cantilever,
topography with the resolution of nanometers. In this kind of	Self sensing,
microscope, micro cantilever is considered as the heart of the	Charge.
microscope and is used as a measuring tool. Piezoelectric	
micro cantilevers are the new generation of the cantilevers	
among the common micro cantilevers that are used in atomic	
force microscopes. Having the ability to self-stimulate and	
self-measure, they have greater popularity among other	
cantilevers.	
This paper is aimed towards investigating the behavior of a	
piezoelectric micro cantilever with a triangular head, in self-	
measure mode and close proximity to the surface of a sample.	
Output charge from the piezoelectric layer and also the output	
current, in this mode, are considered as effective factors in the	
measurement of the bending. The micro cantilever's vibration	
behavior becomes nonlinear, as it approaches the surface of	
the sample. Surely the piezoelectric layer in the self-measure	
mode can be considered as a good measuring tool, only when	
it reflects the effects of the nonlinear interaction between the	
tip of the probe and the surface of the sample in its	
measurements. In order to investigate this matter, first the	
differential equations that are ruling over the vibrating	
triangular hand are transformed into normal nonlinear	
differential equations using the Calendrin method. Then the	
resulting poplinger differential equation is solved using the	
multiple scale method. After solving the governing differential	
aduation of the problem, the micro cantilevers behavior in the	
provinity of the surface of the sample is simulated and the	
effect of factors such as halancing distance oscillation modes	
and the substance of piezoelectric layer are investigated	
and the substance of prozocicetric tayer are investigated.	

¹⁻ Assistant Professor, Department of Mechanics, Faculty of Engineering, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

²⁻ PhD Student, Department of Mechanics, Faculty of Engineering, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

۱- مقدمه

در عصر حاضر نانو تکنولوژی وابستگی شدید به میکروسکوپ نیروی اتمی پیدا کرده است. از این میکروسکوپ میتوان در کاربردهای مختلفی از جمله الکترونیک، نیمه هادیها، ساخت نانو مواد پلیمری، تحلیل-های زیستی، بررسی مواد بیولوژیکی و همچنین مطالعه سطوح فلزی بهره گرفت [۱–۳]. همچنین از این میکروسکوپ میتوان به عنوان یک نانو ربات و همچنین یک نانو حسگر بهره گرفت [۴–۶].

اساس میکروسکوپ نیروی اتمی، میکرو تیر یکسر درگیری است که در قسمت انتهایی آن پرابی با نوک بسیار ظريف قرار گرفته است. در نتيجه برهم کنش نوک پراب با سطح نمونه و یا نانو ذره، نیروی برهم کنش باعث تغییر دامنه و فرکانس تشدید حرکت می شود. به کمک تغییر ایجاد شده در دامنه و یا فرکانس می توان اندازه گیری ها را در این میکروسکوپ انجام داد. میکرو تیرهای معمول در میکروسکوپ نیروی اتمی، میکرو تیرهای مستطیلی سادهای هستند که با تحریک از یایه به ارتعاش در آورده می شوند. اخیراً، نسل جدیدی از میکرو تیرها برای کاربری در میکروسکوپ نیروی اتمی معرفی شدهاند؛ در این نوع میکروتیرها ماده پیزوالکتریک به جای قرارگیری در پایه به عنوان محرک ارتعاشی، به صورت لایهای بر روی میکرو تير قرار گرفتهاست [٧-٨]. با اتصال لايه پيزوالكتريك به ولتاژ متناوب، میکرو تیر مرتعش میشود. با مرتعش شدن میکرو تیر و در نتیجه خمش لایه پیزوالکتریک، بار الکتریکی اضافی در این لایه القاء شده که به کمک آن می توان مقدار خمش را اندازه گیری کرد. بنابراین از این نوع میکرو تیرها میتوان در نقش خود محرک و خود اندازه گیر بهره گرفت. با وجود چنین قابلیتهایی در این نوع تیرها، یهنای باند تحریک گسترده تری در مقایسه با ییزو تیوبهای معمولی ایجاد میشود. این مزیت میکرو تیرهای پيزوالكتريك در مقايسه با محرك هاي پيزو لوله اي حجيم، آنها را به یک انتخاب مناسب برای تصویر برداریهای سرعت بالاي ميكروسكوپ نيروي اتمي تبديل كرده است.

امکان کوچکسازی میکروسکوپ در حالتی که از این میکرو تیرها به عنوان اندازه گیر استفاده می شود و همچنین توانایی استفاده از چند پراب در عملکردهای موازی از دیگر مزایای آنها محسوب میشود [۹]. تاکنون مطالعات زیادی بر روی این تیرها در نقش خود محرک انجام شده است [۱۰–۱۲]. با این وجود، مطالعات صورت گرفته در نقش خود اندازه گیر این نوع تیرها بسیار محدود میباشد. ولف و گوتلیب معادله دیفرانسیل حرکت ارتعاشی میکرو تیر پیزوالکتریک را در نزدیکی سطح نمونه با در نظر گرفتن مدل لنارد- جونز برای نیروی برهم کنش استخراج کرده و استفاده از روش تغییرات جزئی معادله دیفرانسیل غیرخطی حرکت را در حالت غیرتماسی و خود محرک حل کردند [١٣]. روش المان محدود نيز براى تحليل ميكرو تير خودمحرک پيزوالکتريک با در نظر گرفتن لايه پیزوالکتریک سراسری مورد استفاده قرار گرفته است [۱۴]. محمودی و همکارانش با استفاده از تئوری الاستیسیته غیر-خطي حركت ارتعاشي ميكرو تير پيزوالكتريك را در حالت خود محرک دور از سطح نمونه شبیهسازی کردند و با استفاده از روش اختلالات جزئی^۳ معادله دیفرانسیل حرکت را حل نمودند [10–19]. با مقايسه نتايج حاصل از شبيه-سازی و نتایج آزمایشگاهی مشخص گردید که روش اختلالات جزئي از دقت مناسبي در حل معادله ديفرانسيل غیرخطی حرکت برخوردار میباشد. قادری و نجات، میکرو تیر پیزوالکتریک را با در نظر گرفتن ناپیوستگیهای هندسی در مد غیر تماسی میکروسکوپ نیروی اتمی شبیهسازی کردند [۱۷]. آنها با در نظر گرفتن لایه پیزوالکتریک به عنوان محرک در حالت ارتعاش غیرخطی به کمک روش اختلالات جزئی، معادله دیفرانسیل حاکم بر حرکت را حل کرده و تاثیر ابعاد هندسی بر حرکت ارتعاشی را مورد مطالعه قرار دادند.

از میکرو تیر پیزوالکتریک به دو روش مختلف می توان به عنوان اندازه گیر استفاده کرد. پیزو مقاومتی روشی سنتی

¹ Wolf K.

² Gottlieb O.

³ Pertubation

است که از لایه پیزوالکتریک برای اندازه گیری تغییر شکل استفاده می شود [۱۸]. در این روش تنها از یک خاصیت این ماده و آن هم تبدیل انرژی کرنشی به انرژی الکتریکی بهره گرفته میشود. در این روش، تحریک از پایه انجام شده و استفاده از پیزو لولهای اجتناب ناپذیر است. روش دیگری که از آن می توان برای اندازه گیری بهره گرفت، حالت خود اندازه گیر همزمان با خود محرک میباشد [۱۹]. این روش با حذف پیزو لولهای پایه، سرعت اندازه گیری را افزایش مىدهد. مطالعات انجام شده توسط ايتو و سوگا، لى و همكارانش جزء مطالعات آغازين صورت پذيرفته در اين زمينه ميباشد [٢٠–٢١]. آنها با پيشنهاد ميكرو تير ييزوالكتريك تك لايه با سر مثلثي از شارژ الكتريكي القايي در لایه پیزوالکتریک برای اندازه گیری خمش میکرو تیر بهره گرفتند. کورایم و قادری، پاسخ زمانی میکرو تیر پیزوالکتریک را در حالت خود اندازه گیر در مد غیرتماسی میکروسکوپ نیروی اتمی بدست آوردند [۲۲]. نتایج شبیه-سازی نشان دادند که در مدهای نوسانی بالا سرعت پاسخ-دهی تیر به ناهمواری سطح افزایش می یابد.

با توجه به کاربرد بالای میکرو تیرهای پیزوالکتریک در حالت خود اندازه گیر، در این مقاله برای اولین بار به بررسی چگونگی رفتار این نوع تیرها در نزدیکی سطح نمونه و در حالت خود اندازه گیر پرداخته میشود. مدلسازی حرکت ارتعاشی با توجه به تئوری اویلر برنولی حاکم بر تیرها انجام میشود. به منظور حل معادله دیفرانسیل حاکم بر میکرو تیر پیزوالکتریک با استفاده از تقریب گالرکین، متغیرهای حاکم بر مساله جداسازی شده و معادله دیفرانسیل معمولی بدست آمده به کمک روش چند مقیاسی¹ حل میشود. از آنجایی حالت خود اندازه گیر میباشد، پارامترهای شارژ و جریان الکتریکی خروجی از لایه پیزوالکتریک به عنوان پارامترهای مورد مطالعه انتخاب شده و چگونگی تغییرات آنها در نزدیکی سطح نمونه مورد مطالعه قرار می گیرد.

¹ Itoh T.

³ Lee C.

۲- مدلسازی دینامیکی

به منظور مدلسازی دینامیکی میکرو تیر پیزوالکتریک، مطابق شکل (۱) تیر غیریکنواخت پیزوالکتریک با سر مثلثی در نظر گرفته میشود. این تیر مشتمل بر یک لایه پیزوالکتریک محصور بین دو الکترود میباشد. تیر به صورت زاویهدار در ابتدا گیردار و انتهای آزاد آن تحت تاثیر نیروی برهم کنش سطح و نوک پراب است.



با توجه به ضخامت کم لایه های میکرو تیر در مقایسه با سایر ابعاد هندسی، به منظور استخراج معادله دیفرانسیل حاکم بر حرکت ارتعاشی از تئوری اویلر-برنولی استفاده شده و از تاثیر تغییر شکل برشی و اینرسی دورانی بر روی حرکت صرفهنظر میشود. با استفاده از روش لاگرانژ، معادله دیفرانسیل حاکم بر حرکت ارتعاشی میکرو تیر پیزوالکتریک تحت تاثیر نیروی برهم کنش بین نوک و نمونه، با تحریک لایه پیزوالکتریک عبارت است از [۲۲]: $\rho A \ddot{u} + [K(x)u''] + cu + C_e^P d(t) =$ (۱) $F_{ls} H(x-1) \cos \alpha + h_p [F_{ls} H(x-1)] \sin \alpha$

در این رابطه p دانستیه هر یک از لایهها، A مساحت مقطع تیر، c ضریب میرایی، P_dولتاژ ورودی به لایه پیزالکتریک و

² Suga, T.

⁴ Multiple scale

~

پیوستگی در هر مرحله تقسیم نمود. به این ترتیب با استفاده
از روش جداسازی متغیرهای گالرکین، می توان نوشت:
(۶)
$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} U_n(x) q_n(t)$$
 (۶)
که در آن $u(t)$ مختصات عمومی و $(x)_n U$ تابع شکل مد
ارتعاشی n ام است. از آنجایی که میکرو تیر به سه تکه
همگن تبدیل شده است، تابع شکل را می توان به این
صورت بیان نمود:

$$A_{n}^{(1)} \sin\left(\beta_{n}^{(1)}x\right) + B_{n}^{(1)} \cos\left(\beta_{n}^{(1)}x\right) + C_{n}^{(1)} \sinh\left(\beta_{n}^{(1)}x\right) + D_{n}^{(1)} \cosh\left(\beta_{n}^{(1)}x\right), \quad (i = V)$$

$$0 < x < L_{1}$$

$$U_{n}^{(2)}(x) = A_{n}^{(2)} \sin(\beta_{n}^{(2)}x) + B_{n}^{(2)} \cos(\beta_{n}^{(2)}x) + C_{n}^{(2)} \sinh(\beta_{n}^{(2)}x) + D_{n}^{(2)} \cosh(\beta_{n}^{(2)}x), \qquad (- \mathsf{V})$$

$$L_{1} < x < L_{2}$$

معادله
$$U_n^{(3)}(x)$$
 بر اساس شکل هندسی نوک تعیین می شود.
 $U_n^{(3)}(x) = U_n^{(3)}(x) = A_n^{(3)} \sin(\beta_n^{(3)}x) + B_n^{(3)} \cos(\beta_n^{(3)}x) + C_n^{(3)} \sinh(\beta_n^{(3)}x) + D_n^{(3)} \cosh(\beta_n^{(3)}x) + L_2 < x < L$
(A)

که $C_n^{(r)}, B_n^{(r)}, A_n^{(r)}$ و ضرایب $\left(eta_n^{(r)}
ight)^4 = \omega_n^2 m^{(r)} / EI^{(r)}$ و مقادیر مجهولی هستند که از طریق شرایط مرزی و $D_n^{(r)}$ پیوستگی تغییر شکل، شیب، گشتاور خمشی و نیروی برشی و همچنین بی بعد کردن نسبت به جرم قابل محاسبهاند. برای میکرو تیر با نوک مثلثی، مقدار گشتاور دوم سطح تابعی x میباشد. با توجه به معادله خط حاکم بر مثلث نوک میکرو تیر و با جایگذاری رابطه (۶) در معادله دیفرانسیل حرکت در حرکت ارتعاشی آزاد، $U_n^{(3)}(x)$ را می توان از حل (۱) معادله دیفرانسیل رابطه (۹) به دست آورد [۲۳]:

1. 11

$$y_{n} = \frac{\sum_{i=1}^{4} E_{i} W_{i} h_{i} \left(\sum_{j=1}^{i} h_{j} - \frac{h_{i}}{2} \right)}{\sum_{i=1}^{4} E_{i} W_{i} h_{i}}$$
(δ)

نیروی برهم کنش بین سطح و نمونه را می توان بر اساس
مدل لنارد – جونز^۲ به این صورت بیان کرد [۱۴]:
$$f_{ts} = \frac{\hat{H}r}{6\zeta^2} \left[\frac{1}{30} \left(\frac{\zeta}{Z} \right)^8 - \left(\frac{\zeta}{Z} \right)^2 \right]$$
(۳)

که در آن *r* ،*Ĥ و ک* به ترتیب ثابت همکر ⁷، شعاع نوک و اندازه اتمی نمونه می باشند. به منظور حل تحلیلی معادله ديفرانسيل حاكم بر حركت به كمك روش گالركين، مي-توان میکروتیر را به سه تیر همگن با دو سری شرایط

Heaviside function

² Lennard-Jones model

³ Hamaker

$$\xi_{i(n+1)} = \begin{cases} \eta \frac{n-1}{n+1} + b \frac{(n-3)!}{(n+1)!} \\ -\eta b \frac{(n-3)!}{(n+1)!} \xi_{i(n-4)} & n \ge 3 \\ \\ \delta_{in} & n \le 3 \end{cases}$$
(10)

با جایگذاری روابط (۶) و (۷) در معادله دیفرانسیل حرکت (۱) و ضرب داخلی طرفین تساوی در ($U_n(x)$ ، معادله دیفرانسیل معمولی حرکت به دست می آید: $\ddot{q}_n + \omega_n^2 q_n + \mu \dot{q}_n - g_1 q_n^2 - g_2 q_n^3 + g_3 P_d(t) = 0$ (۱۶)

$$q_n + \omega_n q_n + \mu q_n - g_1 q_n - g_2 q_n + g_3 P_d(r) = 0$$
 (17)
در این معادله ω_n فرکانس طبیعی مد n ام و μ میرایی

$$\omega_n^2 = \int_0^1 U_n \left\{ P_1 \left(C_p U_n'' \right)'' - P_4 U_n \operatorname{H}(x - 1) \cos \alpha - \frac{h}{L} P_4 \left[U_n \operatorname{H}(x - 1) \right]' \sin \alpha \right\} dx$$
(1V)

$$g_{1} = \int_{0}^{1} U_{n} \frac{1}{2} \left\{ P_{5} U_{n}^{2} \operatorname{H}(x-1) \cos \alpha + \frac{h}{L} P_{5} \left[U_{n}^{2} \operatorname{H}(x-1) \right]' \sin \alpha \right\} dx$$
(1A)

$$g_{2} = \int_{0}^{1} U_{n} \left\{ P_{s} U_{n}^{3} \operatorname{H}(x-1) \cos \alpha + \frac{h}{L} P_{s} \left[U_{n}^{3} \operatorname{H}(x-1) \right]' \sin \alpha \right\} dx$$
(19)

$$g_3 = \int_0^1 U_n P_3 C_e'' dx \tag{(Y.)}$$

$$P_3 = \frac{1}{L^3 \omega_0^2}; \quad P_4 = \frac{f_1 L}{\omega_0^2}; \quad P_5 = \frac{f_2 L^2}{\omega_0^2}$$
(Y1)

۳- پاسخ فرکانسی حالت تشدید

به منظور حل معادله دیفرانسیل معمولی حرکت یعنی معادله (۱۶)، می توان از روش چند مقیاسی استفاده کرد. روش چند مقیاسی یکی از روش های کار آمد در حل معادلات دیفرانسیل غیرخطی است. آزمایش های عملی انجام شده بر روی حرکت ارتعاشی تیرها نشان می دهند که روش چند-مقیاسی نتایجی با دقت خوب در حل معادله دیفرانسیل حرکت ارائه می دهند [۱۲]. به منظور استفاده از این روش حل حالت ماندگار را می توان به این صورت بسط داد:

$$\eta = \frac{w_1 - w}{w_1 - w} \frac{L_3}{L}, \quad b = \frac{12\rho\omega^2}{P_1 E h_1^2}, \quad P_1 = \frac{1}{\rho A L^4 \omega_0^2} \quad (11)$$

حل تحلیلی برای معادله (۱۰) وجود ندارد. برای حل این معادله که از خانواده معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب متغیر میباشد، روش سری توانی روشی مناسب با دقت محاسبات خوب میباشد [۲۳]. به این ترتیب برای حل معادله (۱۰)، می توان مقدار $U_n^{(3)}$ را با استفاده از سری توانی به این شکل بیان کرد:

$$U_{n}^{(3)}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n} x^{n}$$
(1Y)

پس از جایگذاری معادله (۱۲) در معادله دیفرانسیل (۱۰) ، جواب معادله به این صورت به دست می آید:

$$U_{n}^{(3)}(x) = \sum_{i=0}^{3} C_{i} S_{i}(x)$$
(17)

که در این رابطه:

$$S_{i}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \xi_{in} x^{n}$$
(14)

$$q_{n}(t) = \varepsilon q_{n1}(T_{0}, T_{1}, T_{2}) + \varepsilon^{2} q_{n2}(T_{0}, T_{1}, T_{2}) + \varepsilon^{3} q_{n3}(T_{0}, T_{1}, T_{2}) + o(\varepsilon^{4})$$
(YY)

در این رابطه T_n = *Eⁿt و ع* پارامتری است که از مقدار واحد بسیار کوچک^یتر میباشد. با جایگذاری رابطه (۲۲) در معادله دیفرانسیل (۱۶) و جداسازی ضرایب توانی *ع* میتوان نوشت:

$$O\left(\varepsilon\right): \quad D_0^2 q_{n1} + \omega_n^2 q_{n1} = 0 \tag{(YY)}$$

$$O\left(\varepsilon^{2}\right): \begin{array}{c} D_{0}^{2}q_{n2} + \omega_{n}^{2}q_{n2} + \\ D_{0}D_{1}q_{n1} - g_{1}q_{n1}^{2} = 0 \\ D_{0}^{2}q_{n3} + \omega_{n}^{2}q_{n3} + 2D_{0}D_{1}q_{n2} \end{array}$$
(YF)

$$O\left(\varepsilon^{3}\right): +2D_{0}D_{1}q_{n1} + \mu_{n}D_{0}q_{n1} + D_{1}^{2}q_{n1} \qquad (Y\Delta)$$
$$+g_{3}P_{d} - 2g_{1}q_{n1}q_{n2} - g_{2}q_{n1}^{3} = 0$$

حل معادله دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت (۲۳) را می توان به شکل زیر بیان کرد.

$$q_{n1} = A_n \left(T_1, T_2\right) e^{i\omega_n T_0} + cc \tag{(Y9)}$$

در این رابطه A_n دامنه مختلط و cc مزدوج مختلط جملات گذشته را نشان میدهد. با جایگذرای رابطه (۲۶) در معادله دیفرانسیل (۲۴)، معادله می توان به این صورت بیان کرد:

$$D_{0}^{2}q_{n2} + \omega_{n}^{2}q_{n2} + 2i\omega_{n}D_{1}A_{n}e^{i\omega_{n}T_{0}} -g_{1}\left(A_{n}^{2}e^{2i\omega_{n}T_{0}} + A_{n}A_{n}^{*}\right) + cc = 0$$
(YV)

که ^{*}_n مزدوج مختلط ^A_n است. از آنجایی که هدف حل معادله دیفرانسیل در حالت ماندگار میباشد، جملات تکین معادله (۲۷) حذف میشوند. بنابراین 0 = $D_1A_1 = 0$ خواهد شد. این امر بیان میکند که $A_1 = A_1(T_2)$ به این ترتیب: $q_{n2} = \frac{-g_1A_1^2}{3\omega_2^2}e^{2i\omega_nT_0} + 2\frac{A_1A_1^*}{\omega_2^2} + cc$ (۲۸)

میکروتیر با ولتاژی برابر
$$P_d(T_0) = \frac{1}{2} P_d e^{\Omega T_0} + cc$$
 تحریک
می شود که Ω فرکانس تحریک نزدیک فرکانس طبیعی است
که به این صورت در نظر گرفته می شود:
 T^2 و با به حر

 $\Omega = \omega_n + \varepsilon^2 \sigma$ (۲۹) که در آن σ پارامتر تغییرات^۱ است و انحراف فرکانس تحریک از هر یک از فرکانس های طبیعی را نشان میدهد. با

¹ Detuning parameter

 $2iD_{2}A_{n} + i\mu_{n}A_{n} + \frac{g_{3}r_{d}}{2\omega_{n}}e^{i\sigma T_{2}} - 8A_{n}^{2}A_{n}^{*}\gamma_{f} = 0 \quad (\mathbf{T} \cdot)$ $\sum_{k=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} e^{i\sigma T_{2}} - 8A_{n}^{2}A_{n}^{*}\gamma_{f} = 0$

$$\gamma_f = \frac{\frac{10}{3\omega_n^2} g_1^2 + 3g_2}{8}$$
(٣١)

ضریب _۲۶ معیاری از تاثیر غیرخطی ها بر روی سیستم است و می توان آن را به عنوان یک ضریب غیرخطی معرفی نمود. مقادیر منفی _۲۶ نشان گر پدیده سخت شدگی و مقادیر مثبت آن پدیده نرم شدگی را نشان میدهند. از آنجایی که در اینجا این مقدار همواره مثبت است، بنابراین می توان نتیجه گرفت نیروی غیرخطی بین نوک و نمونه همواره باعث پدیده نرم-شدگی در پاسخ فرکانسی سیستم می شود. به منظور حل معادله (۳۰) باید _م*A* به صورت قطبی در نظر گرفته شود:

$$A_{n} = \frac{1}{2}a_{n}e^{i\beta_{n}}; \quad A_{n}^{*} = \frac{1}{2}a_{n}e^{-i\beta_{n}}$$
 (**YY**)

که در آن a_n و β_n مقادیر حقیقی دامنه و فاز پاسخ می-باشند. با جایگذاری مقادیر رابطه (۳۲) در رابطه (۳۰) و جداسازی قسمت.های حقیقی و موهومی می توان نوشت:

$$\begin{cases} a_n \dot{\tau}_n - a_n \sigma + \frac{g_3 P_d}{2\omega_n} \cos\left(\tau_n\right) - \gamma_f a_n^3 = 0 \\ \dot{a}_n - \frac{g_3 P_d}{2\omega_n} \sin\left(\tau_n\right) + \frac{1}{2} \mu_n a_n = 0 \end{cases}$$
(777)

که در آن $\tau_n = \sigma T_2 - \beta_n$ میباشد. رابطه (۳۳) مدولاسیون پاسخ دامنه a_n و پاسخ فاز π را بیان میکنند. از آنجایی که پاسخ حالت ماندگار مورد توجه میباشد، مقادیر a_n و π برابر صفر فرض میشود. با به توان دو رساندن و جمع دو عبارت τ_n حذف شده و معادله پاسخ فرکانسی غیر-خطی بدست میآید:

$$\left(\frac{1}{2}\mu_n a_n\right)^2 + \left(a_n \sigma + \gamma_f a_n^3\right)^2 = \left(\frac{g_3 P_d}{2\omega_n}\right)^2 \qquad (\mathbf{T}\mathbf{F})$$

معادله پاسخ فرکانسی به دست آمده به خوبی نشان میدهد که به ازای برخی از مقادیر پارامتر تغییرات، بیش از یک دامنه به دست می آید که این امر بیانگر همان پدیده نرمشدگی در پاسخ فرکانسی میباشد.

زمانی که از میکرو تیرک پیزوالکتریک در حالت خود اندازهگیر استفاده میشود، شارژ خروجی از لایه پیزوالکتریک (Q) به عنوان معیاری برای اندازهگیری تغییر شکل میکرو تیر استفاده میشود:

$$Q = W_{3}d_{21}E_{3}Z_{p}\sum_{n=1}^{\infty} \left[\varphi_{n}'(L_{2}) - \varphi_{n}'(L_{1}) \right] q_{n}(t)$$
 (rd)

٤- شبیهسازی پاسخ خود اندازه گیر میکرو تیر

به منظور بررسی چگونگی رفتار میکرو تیر پیزوالکتریک در حالت خود اندازه گیر، میکرو تیر از جنس سیلیکون در نظر گرفته میشود. بر روی آن یک لایه پیزوالکتریک با جنسهای متداول برای تحلیل فرض می-شود. لایه پیزوالکتریک را بین دو الکترود از جنس آلیاژ تیتانیوم و طلا به صورت کامل محصور شده در نظر گرفته میشود. اطلاعات هندسی و خواص فیزیکی مورد نیاز تحلیل به ترتیب در جداول (۱) و (۲) آورده شده است. dm می ایب مدل لنارد-جونز نیز برابر $\sigma=0.34(nm)$

والكتريك	کرو تير پيز	، هندسی می	ول (۱) مشخصات	جدو
L	W	h		
(µm)	(µm)	(µm)	جنس	
307	۲۵۰	۴	Si	لايه پايه
٣۴.	15.	• / 3	Ti/Au	الكترود
		/ · • 1	11/Au	پايىنى
۳۳.	۱۳۰	۴	ZnO	لايه پيزو
۳۳.	۱۳۰	۴	PZT-5H	الكتريك
۳۳۰	13.	۰/۲۵	Ti/Au	الکترود بالايي
120	۵۵	۱۵	Si	نو ک

|--|

h ₁₂	β_{22}	0	Е		
(MV/m)	(Mm/F)	(Kg/m^3)	(GPa)	جنس	
-	-	۲۳۳۰	1.0	Si	لايه پايه
-	-	193.	٧٨	Ti/Au	الکترود پايينې
۵۰۰	40/0	۶۳۹.	1.4	ZnO	لايه پيزو
۷۳۰	39/10	۷۵۰۰	9•/ 9	PZT- 5H	الكتريك

_	_	198	V۸	Ti/Au	الكترود
				11/Au	بالايى
-	-	۲۳۳۰	1.0	Si	نو ک

شكل (۲) پاسخ فركانسی میكرو تیر پیزوالكتریك شبیه-سازی شده را در حالت خود اندازه گیر نشان می دهد. جریان خروجی از لایه پیزوالكتریك به عنوان مبنای اندازه گیر خمش در حالت خود اندازه گیر محسوب می شود. با توجه به شكل (۲)، با افزایش ولتاژ ورودی به لایه پیزوالكتریك جریان خروجی از لایه افزایش می بابد. از آنجایی كه با زیاد شدن ولتاژ تحریك دامنه حركت نیز بیشتر می شود، افزایش جریان خروجی از لایه پیزوالكتریك موید تبعیت پارامتر جریان از دامنه نوسانی می باشد. نتایج این شكل تطابق خوب نتایج شبیه سازی را با نتایج عملی نشان می دهد.



حد نانومتر، نیروی برهم کنش بین نوک پراب و سطح ایجاد می شود. از آنجایی که این نیروی غیرخطی است، بنابراین تاثیر آن بر حرکت ارتعاشی میکرو تیر باعث غیرخطی شدن این حرکت می شود. غیرخطی بودن حرکت ارتعاشی خمیدگی منحنی پاسخ فرکانسی و یا اصطلاحاً پدیده نرم-

شدگی را به همراه دارد. نتایج شکل (۳) نشان میدهند که پدیده نرمشدگی نه تنها در پاسخ فرکانسی دامنه قابل رویت است، بلکه در منحنی پاسخ فرکانسی شارژ خروجی نیز به چشم میخورد. این موضوع به خوبی موید این مطلب است که شارژ خروجی از لایه پیزوالکتریک میتواند در حرکت برده شود. با کاهش فاصله تعادلی بین نوک پراب و سطح نمونه، با توجه به مدل لنارد-جونز نیروی برهم کنش شدت گرفته و در میزان غیرخطی بودن حرکت و یا در واقع خمیدگی منحنی پاسخ فرکانسی تاثیر بیشتری میگذارد. با توجه به نتایج شکل (۳)، شدت گرفتن خمیدگی منحنی پاسخ فرکانسی شارژ خروجی با نزدیک شدن به سطح نمونه نیز قابل رویت میباشد. این موضوع نیز به خوبی تایید کننده میباشد.



شکل (۴)، پاسخ فرکانسی شارژ خروجی از لایه پیزوالکتریک را برای سه مد اول نوسانی میکرو تیر نشان میدهد. با توجه به نتایج این شکل مشخص است که در مد-های نوسانی بالا حساسیت به نیروی غیرخطی کاهش پیدا میکند. بنابراین با توجه به این موضوع لازم است که برای بالا بردن دقت میکرو تیر در کاربری میکروسکوپ نیروی اتمی، توپوگرافی سطح نمونه در مد اول نوسانی انجام پذیرد، تا امکان دسترسی به تصاویری با کیفیت بالاتر میسر گردد. با توجه شکل (۴-الف) مشخص است که جنس لایه پیزوالکتریک نیز بر حساسیت میکرو تیر نسبت به نیروی غیرخطی برهم کنش تاثیر گذار میباشد. با توجه به نتایج این

شکل می توان دریافت که میکرو تیر با لایه پیزوالکتریک از جنس PZT-5A از بین سایر جنسهای انتخاب شده برای لایه پیزوالکتریک نسبت به نیروی برهم کنش حساس تر می-یاشد.



شکل (۴) پاسخ فرکانسی شارژ خروجی در سه مد اول نوسانی با جنسهای مختلف لایه پیزوالکتریک، (الف) مد اول، (ب) مد دوم، (پ) مد سوم

شکل (۵) تاثیر فاصله تعادلی بین نوک پراب و سطح نمونه را بر روی شارژ خروجی از لایه پیزوالکتریک نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود، با نزدیک شدن پراب به سطح نمونه و در نتیجه شدت گرفتن نیروی برهم-کنش شارژ خروجی از لایه پیزوالکتریک کاهش پیدا می-کند. این کاهش شارژ در جنسهای مختلف لایههای

پیزوالکتریک به کار رفته قابل مشاهده میباشد. این کاهش شارژ در توپوگرافی سطح نمونه میتواند مورد استفاده قرار گرفته به عنوان معیاری برای فاصله پراب تا سطح نمونه تلقی گردد.



شکل (۵) تاثیر فاصله تعادلی نوک پراب تا سطح نمونه بر شارژ خروجی از لایه پیزوالکتریک

یکی از عوامل موثر بر حرکت ارتعاشی، ولتاژ تحریک است. مسلماً هر چقدر مقدار ولتاژ ورودی به لایه پیزوالکتریک افزایش یابد، دامنه نوسانی نیز بیشتر خواهد شد. این پدیده در هر فاصله تعادلی میکرو تیر و برای هر-گونه لایه پیزوالکتریکی رخ خواهد داد. تنها تفاوتی که می تواند در یک چنین شرایطی رخ دهد، چگونگی افزایش خواهد بود. شکل (۶) تاثیر افزایش ولتاژ را بر حداکثر دامنه در پاسخ فرکانسی نشان میدهد. نمودارهای این شکل در فاصله تعادلی دو نانومتری به دست آمدهاند. شیب تندتر خط مربوط به H2-TZT نشانگر توانمندتر بودن این ماده در تحریک میکرو تیر است. با توجه به شیب خطوط می توان نتیجه گرفت که بعد از H2-TZT به ترتیب ZnO PZT-54 زوانایی تحریک بالاتری برخوردار می باشند.



٥- نتيجه گيري

در این پژوهش چگونگی رفتار میکرو تیر پیزوالکتریک در حالت خود اندازه گیر و در نزدیکی سطح نمونه مدل-سازی گردید. از آنجایی که میکرو تیر در نزدیکی سطح نمونه دچار حرکت ارتعاشی غیرخطی میشود، به منظور حل معادله دیفرانسیل حاکم بر حرکت ابتدا معادله با در نظر گرفتن ناپیوستگیهای هندسی به کمک روش گالرکین تبدیل به معادله دیفرانسیل غیرخطی معمولی گردید و سپس با استفاده از روش چند مقیاسی شد. با مطالعه چگونگی تغییرات رفتار این پارامترها در نزدیکی سطح نمونه نتایج زیر حاصل گردید:

- ۱- با نزدیک شدن میکرو تیر به سطح نمونه و در نتیجه شدت گرفتن نیروی غیرخطی برهم کنش سطح و پراب، منحنی پاسخ فرکانسی شارژ خروجی خمیده میشود و با نزدیک تر شدن میکرو تیر به سطح نمونه میزان این خمیدگی شدت می گیرد.
- ۲- در مدهای نوسانی بالاتر حساسیت شارژ خروجی
 به نیروی غیرخطی کاهش مییابد. این موضوع
 عملکرد بهتر میکرو تیر در مد اول را نشان می دهد.
- ۳- با نزدیک شدن میکرو تیر به سطح نمونه شارژ
 خروجی از لایه پیزوالکتریک کاهش مییابد. از
 این مهم میتوان در توپوگرافی سطح نمونه بهره
 گرفت.

٦- فهرست علائم

E	ىدول الاستيسيته (MPa)

- β₂₂ (Mm/F) ثابت دى الكتريك
- ثابت پيزوالکتريک (MV/m)

شارژ خروجي از لايه پيزوالکتريک(c/m) Q

مراجع: [1] Vigneswaran N., Samsuri F., Ranganathan B., Recent Advances in Nano Patterning

- [10] Korayem M.H., Ghaderi R., Sensitivity analysis of nonlinear vibration of AFM piezoelectric MC in liquid, *International Journal of Mechanics and Materials in Design*, 10(2), 2014, pp. 121–131.
- [11] Rogers B., Manning L., Sulchek T., Adams J.D., Improving tapping mode atomic force microscopy with piezoelectric cantilevers, *Ultramicroscopy*, 100, 2004, pp. 267-276.
- [12] Mahmoodi S.N., Jalili N., Non-linear vibrations and frequency response analysis of piezoelectrically driven microcantilevers, *International Journal of Non-Linear Mechanics*, 42, 2007, pp. 577-587.
- [13] Wolf K., Gottlieb O., Nonlinear dynamics of a noncontacting atomic force microscope cantilever actuated by a piezoelectric layer, *Journal of Applied Physics*, 91(7),2002, pp. 4701-4712.
- [14] Fung R.F., Huang S.C., Dynamic modeling and vibration analysis of the atomic force microscope, ASME Journal of Vibration and Acoustics, 123, 2001, pp. 502–509.
- [15] Mahmoodi S.N., Dagag M.F., Jalili N., On the nonlinear flexural response of piezoelectrically driven microcantilever sensors, *Sens. and Act. A*, 153, 2009, pp. 171-179.
- [16] Mahmoodi S.N., Jalili N., Ahmadian M., Subharmonics analysis of nonlinear flexural vibrations of piezoelectrically actuated microcantilevers, *Nonlinear Dynamics*, 59, 2010, pp. 397-409.
- [17] Ghaderi R., Nejat A., Nonlinear Mathematical Modeling of Vibrating Motion of Nanomechanical Cantilever Active Probe, *Latin American Journal of Solids and Structures*, 11, 2014, pp. 369-385.
- [18] Shin Ch., Jeon I., Khim Z.G., Hong J.W., Nam H.J., Study of sensitivity and noise in the piezoelectric self-sensing and selfactuating cantilever with an integrated Wheatstone bridge circuit, *Review of Scientific Instruments*, 81, 2010, 035109.
- [19] Dong W., Lu X., Cui Y., Wang J., Liu M., Fabrication and characterization of microcantilever integrated with PZT thin film sensor and actuator, *Thin Solid Films*, 515, 2007, pp. 8544–8548.

and Nano Imprint Lithography for Biological Applications, *Procedia Engineering*, 97, 2014, pp. 1387-1398.

- [2] Muthukumar T., Prabhavathi S., Chamundeeswari M., Sastry T.P., Biomodified carbon nanoparticles loaded with methotrexate possible carrier for anticancer drug delivery, *Materials Science and Engineering: C*, 36(1), 2014, pp. 14-19.
- [3] Grayeli-Korpi A-R., Savaloni H., Habibi M., Corrosion inhibition of stainless steel type AISI 304 by Mn coating and subsequent annealing with flow of nitrogen at different temperatures, *Applied Surface Science*, 276(1), 2013, pp. 269-275.
- [4] Jalili N., Laxminarayana K., A Review of Atomic Force Microscopy Imaging Systems: Application to Molecular Metrology and Biological Sciences, *International Journal of Mechanics*, 14 (8), 2004, pp. 907-914.
- [5] Moosapour M., Hajabasi M.A., Ehteshami H., Thermoelastic damping effect analysis in micro flexural resonator of atomic force microscopy, *Applied Mathematical Modelling*, 38 (11-12), 2014, pp. 2716-2733.
- [6] Kangarlou H., Aghgonbad M.M., Incidence angle dependence on structural and optical properties of UHV deposited copper nano layers, *International Journal for Light and Electron Optics*, 125(19), 2014, pp. 5532-5537.
- [7] Adams J.D., Parrott G., Bauer C., Sant T., Manning L., Jones M., Rogers B., McCorkle D., Ferrel T.L, Nanowatt chemical vapor detection with a selfsensing, piezoelectric microcantilever array, *Applied Physics Letters*, 83, 2003, pp. 3428-3440.
- [8] Salehi-Khojin A., Bashash S., Jalili N., Modeling and Experimental Vibration Analysis of Nanomechanical Cantilever Active Probes, *Micromechanics and Microengineering*, 18, 2008, 085008 (11pp).
- [9] Liqun D., Guiryong K., Fumihito A., Toshio F., Kou-ichi I., Yasunori T., Structure design of micro to-uch sensor array, *Sensors and Actuators A*, 107, 2003, pp. 7-13.

- 027
- [20] Itoh T., Suga T., Self-excited force sensing mic-rocantilevers with piezoelectric thin films for dynamic scanning force, *Sensors and Actuators A: Physics*, 54, 1996, pp. 477–481.
- [21] Lee C., Itoh T., Suga T., Self-excited piezoelectric PZT microcantilevers for dynamic SFM-with inh-erent sensing and actuating capabilities, *Sensors and Actuators A.*, 72, 1999, pp. 179–188.
- [22] Korayem M.H., Ghaderi R., Vibration response of a piezoelectrically actuated microcantilever subjected to tip–sample interaction, *Scientia Iranica B*, 20 (1), 2013, pp. 195–206.
- [23] Shen K., Dynamic behavior of atomic force microscope cantilevers, the thesis presented to degree of doctor of philosophy, the University of Nebraska, 2005.